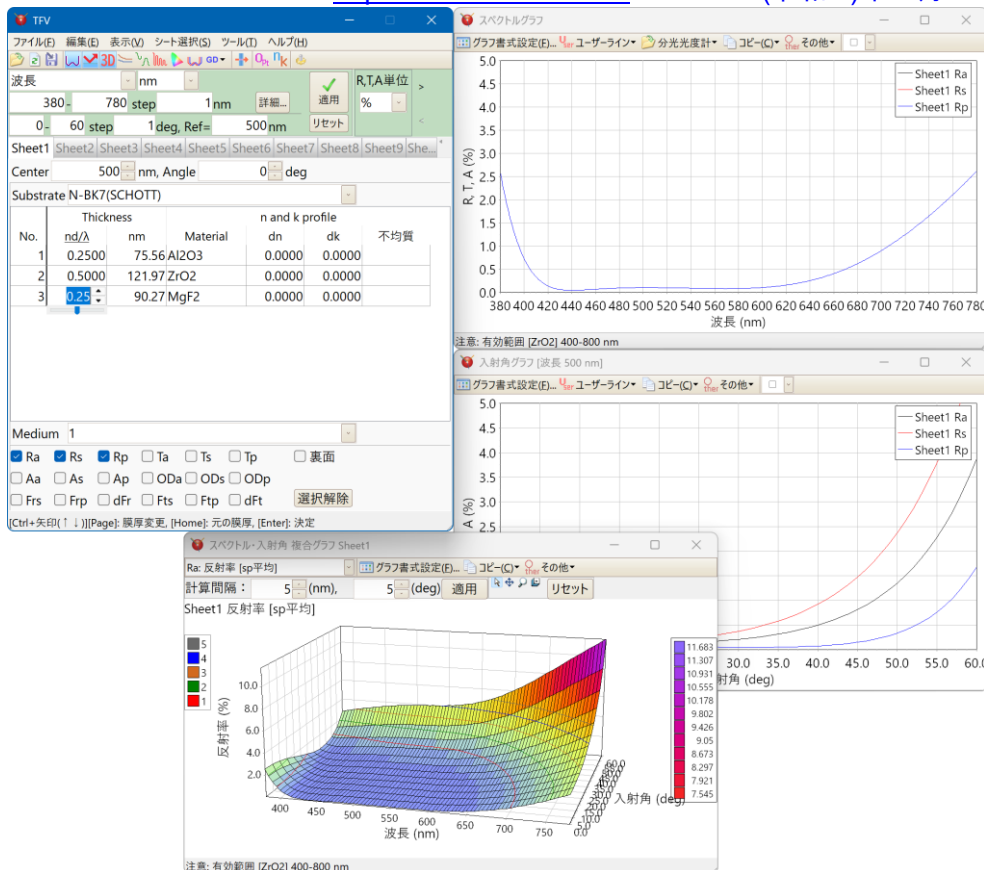


光学薄膜設計ソフトウェア TFV Version 3.4 簡易パンフレット第 1 版

<https://thinfilmview.com/>

2025(令和 7)年 4 月



特徴

直感的でわかりやすい操作性。
リアルタイム計算システムによる、きびきびとした動作。
スライドバーやアップダウンボタンによるマウス操作で膜厚や屈折率が素早く変更可能。
タブ型シートにより、最大 20 までの設計データを同時に表示可能。
多くのスペクトルの種類と単位に対応。

仕様

最大層数: 5000 層(シート内の表の行数が 5000 行まで)

動作に必要な環境

Windows® 10 または 11。
8GB 以上のメモリ(16GB 以上を推奨)。
USB ポート(ハードキーに使用)。
Full HD(1920×1080)以上の画面解像度。

主な機能

- 反射率、透過率、吸収、光学濃度、位相、群遅延のグラフ表示および数値表示

スペクトルの種類	単位
波長	Å, nm, μm, mm
周波数	PHz, THz, GHz
波数	cm ⁻¹ , μm ⁻¹ , 2π/cm
角周波数	rad/fs
エネルギー	eV, keV
g 値	

反射率、透過率、吸収率の単位
0-1, %, dB

膜厚の単位
物理膜厚: Å, nm, μm, mm
光学膜厚: FWOT, QWOT

- 基板および膜物質の分散データ(n および k)のグラフ表示および数値表示
- ツリーリングファクターや真空中の屈折率を考慮した光学式蒸着モニターシミュレーション
- 電場強度分布のグラフ表示および数値表示
- 色計算・色差計算
XYZxy, CIE L*a*b*, L*C*h, Hunter Lab, L*u*v*, UCS, Whiteness Index, Yellowness Index, sRGB, CIE2000, Dominant Wavelength
- 製造誤差解析: 各層の膜厚・屈折率・吸収係数の増減に対する、光学特性の変化解析およびモンテカルロシミュレーション
- 設計の最適化
ローカルサーチ、グローバルサーチ、ニードルサーチ
- 単層膜測定値から n と k の解析
- グラフへの分光光度計測定データファイル読み込み表示
日立ハイテック (UDSS, UDS, UDA, UV1 ファイル)、島津 SPC ファイル、Olympus-USPM ファイル、日本分光 JWS ファイル、Ocean Optics OOi-Base32 ファイル、csv ファイル読み込みに対応。相対測定値を絶対値に変換可能。

- 多言語対応: 日本語、英語および繁体中文

詳しくは、TFV ホームページをご参照ください。<https://thinfilmview.com/>

総販売代理店

有限会社 テックウェア <https://techware-inc.net/>

〒143-0015 東京都大田区大森西 4-17-31

TEL/FAX: 03-3761-7599 E-mail: techware.tokyo@gmail.com

担当: 小島 090-1439-6411 (携帯)

開発元

ナリー・ソフトウェア <https://nary-software.com/>

E-mail: support@nary-software.com